

Номер п/п	Наименование квалификации	Наименование и реквизиты профессионального стандарта, на соответствие которому проводится независимая оценка квалификации	Уровень (подуровень) квалификации, в соответствии с профессиональным стандартом	Положения профессионального стандарта			Квалификационное требование, установленное федеральным законом и иным нормативным правовым актом Российской Федерации, и реквизиты этого акта	Перечень документов, необходимых для прохождения профессионального экзамена по соответствующей квалификации	Срок действия свидетельства о квалификации	Дополнительные характеристики и (при необходимости): наименование профессии рабочего, должности руководителя, специалиста и служащего в соответствии с ЕТКС, ЕКС с указанием разряда работы, профессии/категории и должности/класса профессии
				код трудовой функции	наименование трудовой функции	дополнительные сведения (при необходимости)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Инженер по разработке средств функционального контроля интегральной схемы и ее составных блоков (6 уровень квалификации)	Специалист по функциональной верификации и разработке тестов функционального контроля наноразмерных интегральных схем Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «11» апреля 2014 г. № 235н	6	В/01.6	Разработка эталонных образцов тестовых воздействий, используемых измерительным оборудованием для отбраковки интегральных схем	–	–	1. Документ, подтверждающий наличие высшего образования не ниже уровня бакалавриата. по одному из направлений: «Электроника и микроэлектроника»; «Электроника и нанoeлектроника»; «Нанотехнологии и микросистемная техника»;	3 года	–

				V/02.6	Разработка программ измерения для автоматизированных измерительных систем, проверяющих определенные свойства или параметры интегральных схем			«Информатика и вычислительная техника» ИЛИ 1. Документ, подтверждающий наличие высшего образования не ниже уровня бакалавриата 2. Документ о профессиональной переподготовке по профилю подтверждаемой квалификации	
				V/03.6	Сборка программно-аппаратного измерительного комплекса, обеспечивающего автоматизированное тестирование интегральных схем				
				V/04.6	Исследование функциональных параметров интегральных схем на опытной партии кристаллов				
				V/07.6	Тестирование кристаллов интегральных схем в целях отбраковки				